# 05;08 Стимулированный ультразвуком перенос микрочастиц на поверхности пластины LiNbO<sub>3</sub>

## © А.Н. Горб, О.А. Коротченков

# Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина

#### Поступило в Редакцию 1 апреля 2002 г.

Зарегистрировано стимулированное ультразвуком (УЗ) различной частоты перемещение микрочастиц SiC на поверхности пластины-звукопровода LiNbO<sub>3</sub>. Обнаружено, что вероятности прямого и обратного перемещений соответственно в направлении распространения УЗ и в противоположном направлении близки для моды  $a_1$  волн Лэмба. В случае возбуждения моды  $s_1$  наблюдается преимущественное прямое перемещение микрочастиц. Металлизация поверхности LiNbO<sub>3</sub> приводит к значительному падению доли перемещаемых частиц для моды  $s_1$ . Указанные закономерности интерпретируются в рамках модели, учитывающей характер колебаний частиц поверхности LiNbO<sub>3</sub> на модах  $a_1$  и  $s_1$  и существование переменного пьезоэлектрического поля, сопровождающего УЗ. Предложена возможность использования обнаруженных закономерностей для транспортировки нейтральных и заряженных микрочастиц, включая биологические объекты.

Исследование процессов переноса вещества в различном агрегатном состоянии с использованием ультразвуковых волн представляет несомненный интерес с научной и прикладной точек зрения. Динамика поведения ансамбля микрочастиц вблизи пластины-звукопровода обнаруживает черты, свойственные как жидкости, так и твердому телу. При этом особенности такой динамики остаются слабо изученными [1,2]. Практические приложения данного эффекта связаны в значительной степени с возможностью циклического перемещения жидкостей и находящихся в ней частиц при контакте с пластиной-звукопроводом [3]. В частности, данный способ может найти применение в молекулярной микромеханике и переносе микробиологических объектов [4].

Учитывая различный характер соотношения компонент упругих смещений для разных мод волн в пластинах, следует ожидать существенных особенностей переноса микрочастиц на поверхности LiNbO<sub>3</sub>

67

при возбуждении в пластине различных мод. Кроме того, распространение ультразвуковых (УЗ) волн в пьезоэлектрической пластине LiNbO<sub>3</sub> сопровождается переменным пьезоэлектрическим полем. Поскольку это поле проникает за пределы пластины, следует ожидать его взаимодействия с микрочастицами с соответствующим влиянием на процесс их переноса вдоль поверхности LiNbO<sub>3</sub>. Выяснению двух указанных проблем и посвящена данная работа.

В эксперименте использовалась пластина ниобата лития УZ-среза толщиной 630 µm. Для возбуждения УЗ-волн она размещалась на заземленном металлическом основании (1 на вставке рис. 1). На верхнюю грань пластины LiNbO<sub>3</sub> наносился медный электрод 2 шириной 1 mm. Приложение высокочастотного электрического напряжения V между электродами 1 и 2 приводило к возбуждению в пластине УЗ-волн Лэмба [5]. Сопоставление экспериментально возбуждаемых резонансных мод (регистрация осуществлялась с помощью дополнительного медного электрода, находящегося на удалении  $\approx 1\,\mathrm{cm}$  от электрода 2 на вставке рис. 1) и теоретически рассчитанных частот рождения мод в данной пластине [6] позволило идентифицировать тип ряда нижайших волн Лэмба. Дальнейшие исследования проводились на двух частотах,  $f_1 = 3.7 \,\text{MHz}$  и  $f_2 = 5.2 \,\text{MHz}$ , идентифицированных как моды  $a_1$  и  $s_1$  соответственно. При этом прикладываемое напряжение V выбиралось из условия равенства акустической мощности для обеих мод. Последняя оценивалась из сопротивления излучения [7] с учетом измеренных ранее значений коэффициента электромеханической связи для мод  $a_1$  и  $s_1$  [8]. Напряжение устанавливалось для случая свободной поверхности LiNbO<sub>3</sub> и оставалось неизменным в случае металлизации поверхности медным слоем 4 (вставка на рис. 1), осуществляемый с целью экранировки пьезоэлектрического поля. В качестве транспортируемых частиц (3 на вставке рис. 1) использовался порошок SiC со средним диаметром около  $30\,\mu m$  и разбросом диаметра до  $15\,\mu m$ . Оценки массы микрочастиц дают значения в пределах от 10<sup>-6</sup> до 10<sup>-7</sup> g. При возбуждении УЗ наблюдалось перемещение частиц по поверхности пьезопластины, которое имело характер последовательных прыжков на расстоянии, преимущественно не превышавшие 1-2 mm. Перемещения частиц регистрировались визуально с помощью оптического микроскопа. Путем последователно проводимых измерений отслеживались треки перемещения отдельных микрочастиц и групп из нескольких микрочастиц, совершаемые за одинаковые промежутки времени. Приведенные ниже графики усреднены по нескольким сотням



**Рис. 1.** Распределение относительной вероятности (R) перемещения частиц SiC на поверхности пластины LiNbO<sub>3</sub> для моды  $s_1$  волн Лэмба в случае свободной (a) и металилзированной (b) поверхности. Вставки иллюстрируют: используемые схемы эксперимента (см. текст); эллиптические смещения  $U_y$  и  $U_z$  частиц среды на поверхности пластины (стрелка указывает направление их движения). (D -смещение).

таких временны́х интервалов, что позволило получить зависимости относительной вероятности выпадения данного перемещения микрочастицы от величины самого перемещения для разных возбуждаемых мод волн Лэмба.



Рис. 2. То же, что и на рис. 1, для моды *a*<sub>1</sub> волн Лэмба.

Исследованиями обнаружена существенная зависимость распределения указанной вероятности перемещения на свободной поверхности LiNbO<sub>3</sub> от типа возбуждаемой моды УЗ-графики a рис. 1 и 2. Видно, что имеют место перемещения микрочастиц как в направлении УЗ-волны (положительные значения перемещений на графиках a), так и в противоположном направлении (отрицательные значения). При этом существенно подчеркнуть, что вероятности противоположных смещений близки друг к другу для моды  $a_1$  волн Лэмба (рис. 2, a). В случае же возбуждения моды  $s_1$  вероятность смещения частиц

вдоль направления распространения УЗ существенно выше вероятности обратного смещения (рис. 1, a).

Указанные закономерности могут быть проанализированы с учетом характера смещений на поверхности пьезопластины при возбуждении волн Лэмба. В нашем случае реализуются волны Лэмба с компонентами смещений U<sub>v</sub> и U<sub>z</sub> [6]. Количественный анализ величины данных компонент с учетом пьезоэффекта не является целью данной работы. Ограничимся качественным рассмотрением, строго справедливы лишь для изотропной пластины. Тогда компоненты смещения U<sub>v</sub> и U<sub>2</sub> фиксированной точки на поверхности представимы в виде [5]:  $U_v = i\alpha \exp(i\omega t), U_z = \beta \exp(i\omega t)$  для моды  $s_1$  и  $U_v = \gamma \exp(i\omega t),$  $U_z = i\delta \exp(i\omega t)$ для моды  $a_1$ , где i — мнимая единица,  $\omega = 2\pi f$  — круговая частота, t — время, а  $\alpha, \beta, \delta, \gamma$  — некоторые постоянные. Следовательно, частицы поверхности пластины при возвратно-поступательном движении описывают эллипс, причем движение совершается по часовой стрелке в случае моды  $s_1$  (вставка на рис. 1) и против часовой стрелки для моды  $a_1$  (вставка на рис. 2). Соответственно направлению движения поверхности для моды  $s_1$  волн Лэмба на микрочастицы, расположенные на ней, действуют силы, обусловливающие их доминирующее перемещение в положительном направлении оси Z, что и наблюдается на рис. 1, а. В случае же моды а1 следует ожидать значительной вероятности перемещения микрочастиц в обратном направлении, что и иллюстрирует рис. 2, а.

Предположим далее, что движение микрочастиц возле пластины LiNbO<sub>3</sub> можно рассмотреть в рамках гидродинамического подхода (см., например, [9]). В этом случае помимо возвратно-поступательного движения микрочастиц, рассмотренного выше, следует учесть и их дрейф в направлении распространения УЗ. Так, аппроксимируя скорость микрочастицы  $v(z,t) = A \cos(\omega t - kz)$  (k — волновое число УЗ) и записывая уравнение непрерывности div( $\rho v$ ) =  $-\partial \rho / \partial t$  ( $\rho = \rho_0 + \tilde{\rho}$  — плотность микрочастиц, включающая невозмущенное волной значение  $\rho_0$  и "ультразвуковую" добавку  $\tilde{\rho}$ ), получим дрейфовую скорость  $v_d = \langle \tilde{\rho} v \rangle / \rho_0 = \rho_0 A^2 / 2\omega$  ( $\langle \dots \rangle$  — знак усреднения) в направлении распространения УЗ. Указанный дрейф объясняет значительную долю положительных смещений микрочастиц, наблюдаемых на рис. 2, *a*.

Для выяснения роли пьезоэлектрических полей в наблюдаемых перемещениях проанализируем смещения микрочастиц в случае экранировки пьезополей на поверхности LiNbO<sub>3</sub> — гарфики *b* на рис. 1 и 2.

Видно, что количество переносимых частиц существенно снизилось для моды  $s_1$  (график *b* на рис. 1). Интерпретируя данный факт, отметим, что металлизация поверхности LiNbO3 приводит к увеличению фазовой скорости волн Лэмба [10] с соответствующим увеличением длины волны в пределах до 25%. Это обусловливает уменьшение компонент смещений  $U_v$  и  $U_z$ , хотя сама величина подобного эффекта ранее не сообщалась. Отметим, однако, что в случае поверхностных волн в LiNbO<sub>3</sub> металлизация поверхности сопровождается уменьшением обеих компонент в пределах от 10 до 30% [7]. Можно, следовательно, предположить, что наблюдаемое на рис. 1, b уменьшение вероятности смещения микрочастиц при металлизации поверхности (до 2.5 раза) не может быть вызвано исключительно уменьшением  $U_y$  и  $U_z$ . Такое предположение подтверждают и данные рис. 2, b для моды  $a_1$ , поскольку металлизация поверхности приводит не к уменьшению, а к различимому увеличению вероятности смещения микрочастицы для данной моды. Мы полагаем, что объяснение указанных закономерностей возможно с учетом пьезоэлектрического поля, сопровождающего УЗ-волну. В рамках такого подхода микрочастицы захватываются в потенциальных минимумах, формируемых пьезополем, и транспортируются вдоль направления распространения волны. Это и обусловливает значительное увеличение вероятности положительных перемещений на рис. 1, а по сравнению с соответствующей вероятностью на рис. 1, b. С другой стороны, для моды *a*<sub>1</sub> вероятность захвата микрочастицы в движущийся в направлении Z потенциальный минимум существенно меньше соответствующей величины для моды s<sub>1</sub> вследствие обратного движения частиц поверхности LiNbO<sub>3</sub> (вставка на рис. 2). Это и обусловливает отсутствие роста положительных смещений с одновременным возрастанием доли обратных смещений микрочастиц на рис. 2, а в сравнении с рис. 2, b. Что касается физического механизма предполагаемого захвата, то он может быть обусловлен, например, описанным ранее поляризационным взаимодействием микрочастиц с электрическим полем [11,12].

Таким образом, в работе зарегистрировано существенное влияние типа возбуждаемой в пластине LiNbO<sub>3</sub> моды волн Лэмба на характер перемещений микрочастиц на ее поверхности. Показано, что эти перемещения можно объяснить действием колеблющейся поверхности звукопровода и пьезоэлектрическим полем, сопровождающим волну в пластине. Полученные результаты могут найти применение в разработ-ке устройств для транспортировки твердых микрочастиц и их взвесей, включая биологические объекты.

Авторы выражают признательность П.П. Ильину за обсуждение свойств волн Лэмба.

## Список литературы

- [1] Korotchenkov O.A., Goto T. // Phys. Rev. B. 1997. V. 56. N 21. P. 13 646–13 649.
- [2] Korotchenkov O.A., Goto T. // J. Appl. Phys. 1999. V. 85. N 2. P. 1153-1158.
- [3] Moroney R.M., White R.M., Howe R.T. // Appl. Phys. Lett. 1991. V. 59. N 7. P. 774–776.
- [4] Julicher F., Ajdari A., Prost J. // Rev. Mod. Phys. 1997. V. 69. N 4. P. 1269–1281.
- [5] Викторов И.А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике. М.: Наука, 1966. 168 с.
- [6] *Бурлий П.В., Горб А.Н., Кучеров И.Я.* и др. // Вестник Киевского университета. Серия: физ.-мат. науки. 2000. № 2. С. 470–476.
- [7] Дьелесан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. М.: Наука, 1982. 424 с.
- [8] Бурлий П.В., Горб А.Н. // Вестник Киевского университета. Серия: физ.-мат. науки. 2001. № 1. С. 421-427.
- [9] Физическая акустика. Т. 2. Свойства полимеров и нелинейной акустики. Ч. Б. / Под ред. У. Мэзона. М.: Мир, 1969. 420 с.
- [10] Бурлий П.В., Ильин П.П., Кучеров И.Я. // Укр. физ. ж. 1978. Т. 23. № 10. С. 1730–1732.
- [11] Rousselet J., Salome L., Ajdari A. et al. // Nature 1994. V. 370. P. 446-448.
- Faucheux L.P., Bourdieu L.S., Kaplan P.D. et al. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 74.
  N 9. P. 1504–1507.